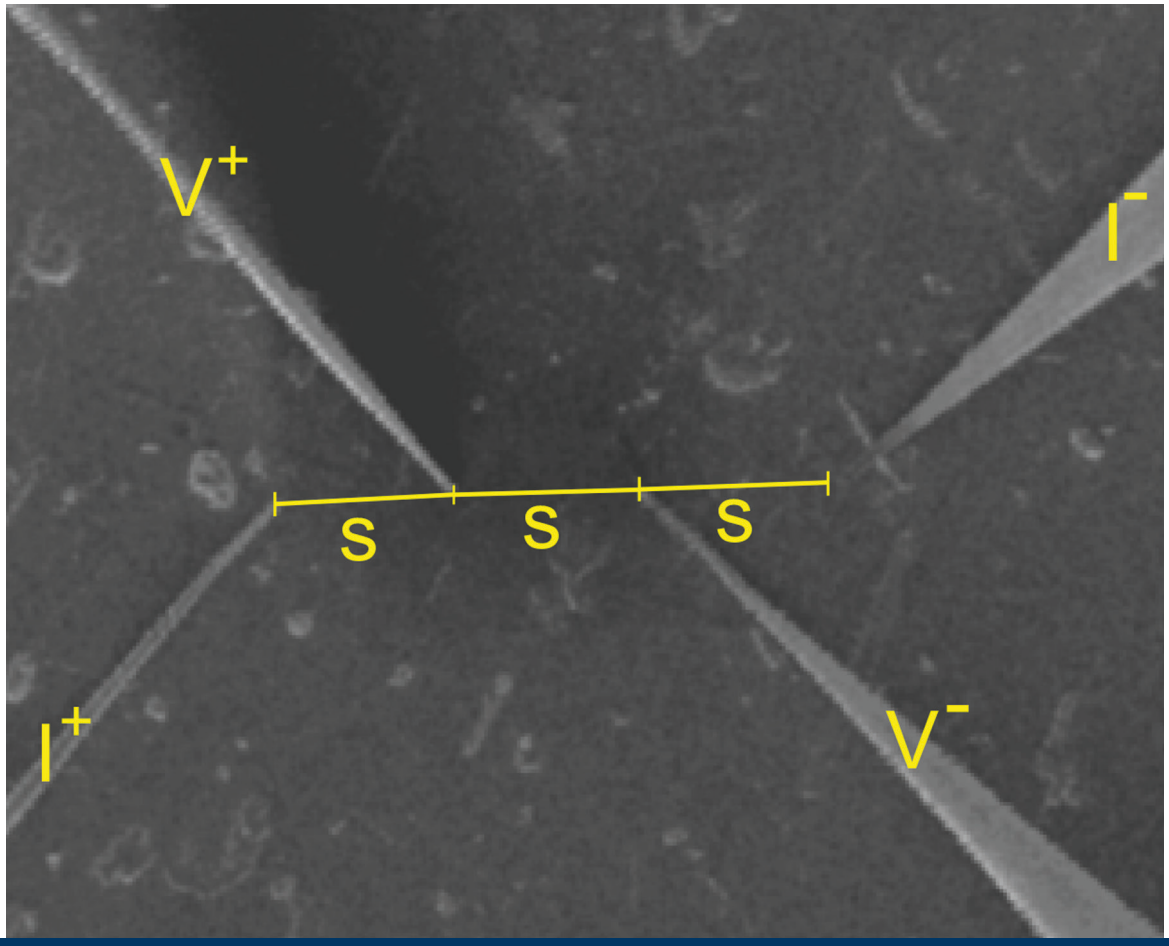

Direct measurement of anisotropic resistivity in thin films using a 4-probe STM

Tim Flatten

Schlüsseltechnologien / Key Technologies
Band / Volume 213
ISBN 978-3-95806-460-7

Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft

JÜLICH
Forschungszentrum

Forschungszentrum Jülich GmbH
Peter Grünberg Institut (PGI)
Elektronische Eigenschaften (PGI-6)

Direct measurement of anisotropic resistivity in thin films using a 4-probe STM

Tim Flatten

Schriften des Forschungszentrums Jülich
Reihe Schlüsseltechnologien / Key Technologies Band / Volume 213

ISSN 1866-1807 ISBN 978-3-95806-460-7

Contents

Schlüsseltechnologien / Key Technologies
Band / Volume 213
ISBN 978-3-95806-460-7

Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft

JÜLICH
Forschungszentrum